

Journée technique PRECEND : Tomographie

14 mai 2019

La tomographie est de plus en plus sollicitée par les industriels : en effet, les possibilités et performances se sont accrues ces dernières années, notamment avec l'**amélioration des performances informatiques**. Et la **facilité apparente** en fait une approche particulièrement appréciée.

Néanmoins, elle **nécessite un degré avancé de connaissances** du fait d'une technicité plus importante qu'il n'y paraît !

Cette journée est donc l'occasion de **faire le point sur les limites et avancées**, ainsi que de **découvrir des applications remarquables**.

Programme :

9h00 : Accueil – café – thé – viennoiseries sur le village Precend

9h30 : Introduction, *Cyril Kouzoubachian (Precend)*

9h45 : Localisation de défauts par μ tomographie X sur cartes & composants électroniques, *Clovis Lataste (Elemca)*

10h15 : Contrôle non destructif de pièces aéronautiques en composites à matrice céramique par tomographie à rayons X, *Olivier Rodriguez (Voxaya)*

10h45 : Utilisation de la tomographie multi-échelles pour le développement et la recherche, *Solène Valton (RX-Solutions)*

11h15 : Avancement du projet Collaboratif FUI GigaQuant, de nouvelles méthodologies de traitement d'images 3D, *Laurent Bernard (Reactiv'IP)*

11h45 : Présentation des exposants

12h00 : Cocktail déjeunatoire puis échanges autour des exposants :



14h00 : Utilisation de la réalité augmentée pour la tomographie, *Sylvain Ordureau (Vizua 3D)*

14h30 : Tomographie par ondes Térhertz : nouveaux paliers technologiques, *Thierry Antonini (T-Waves Technologies)*

15h00 : Performances actuelles de la tomographie neutronique : quels atouts pour quels cas spécifiques, *Nicolas Lenoir (3SR - Université de Grenoble Alpes)*

15h30 : Tomographie robotisée de grande dimension, *Fanny Buyens (CEA-Tech)*

16h00 : Méthodologie de quantification de l'orientation de plis composites, *Benoît Bily (Cetim)*

16h30 : Conclusion - fin